

各種分析の受託

当社の無機粉体製造、耐火物等のセラミック製造において培った技術・ノウハウを活かし、鉍物・セラミック・無機粉体などの各種分析を行います。

新たな原料の物性や成分を確認したい。新たな品質検査項目を検討している。品質異常の原因を見つけたい。など、スポットでのご依頼でも歓迎です。

まずはお問合せ下さい。

昭和KDE株式会社

分析担当窓口

Tel.0288-25-7460

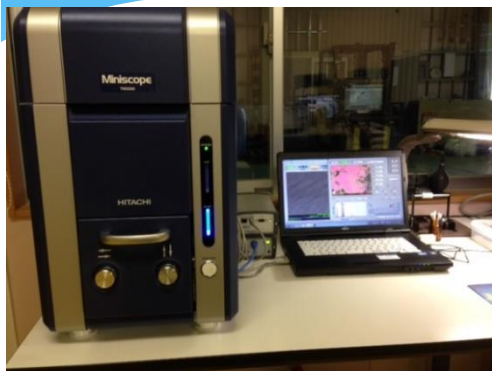
Mail : bunseki@showa-hp.co.jp

主な分析装置と項目

形態観察 (SEM-EDX)

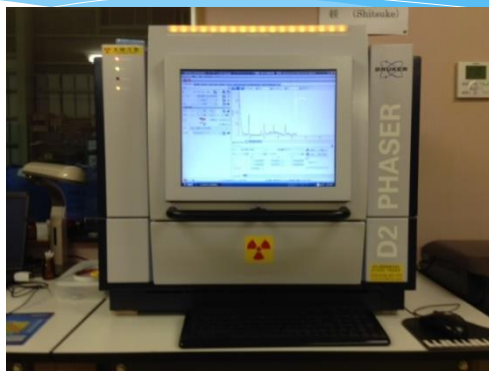
HITACHI Miniscope TM3000

BRUKER Quantax 70



鉱物組成解析 (XRD)

BRUKER D2 PHASER



化学成分分析 (XRF)

Rigaku ZSX PrimusIII+



化学成分分析 (ICP)

島津 ICPS-8100



保有装置	主要な分析・測定
X線回折装置 (XRD)	鉱物の定性 定量分析
蛍光X線分析装置 (XRF)	化学組成 (定性・定量分析)
プラズマ発光分析装置 (ICP)	
電子顕微鏡 (SEM-EDX)	形態観察・化学組成 (元素マッピング)
熱分析 (TG-DTA)	熱重量変化
マルチピクノメーター	真比重
電気炉	水分・強熱減量 (Ig.Loss)
水分計	
レーザー回折式 粒度分布測定装置	粒度 (粉体・破碎品)
振動篩	
pHメーター	pH
ブレン測定器	比表面積

試料調整

適切な分析結果を得るために、試料を加工・処理を行います。

切断: スラブソー



研磨: 平面研磨機



破碎: サンプルジョークラッシャー



粉砕: 振動ミル、リングミル



縮分: サンプル縮分器



篩掛け: 篩(ふるい振とう器)



ビードサンプラー (XRF)



薬品処理 (酸・アルカリ等)

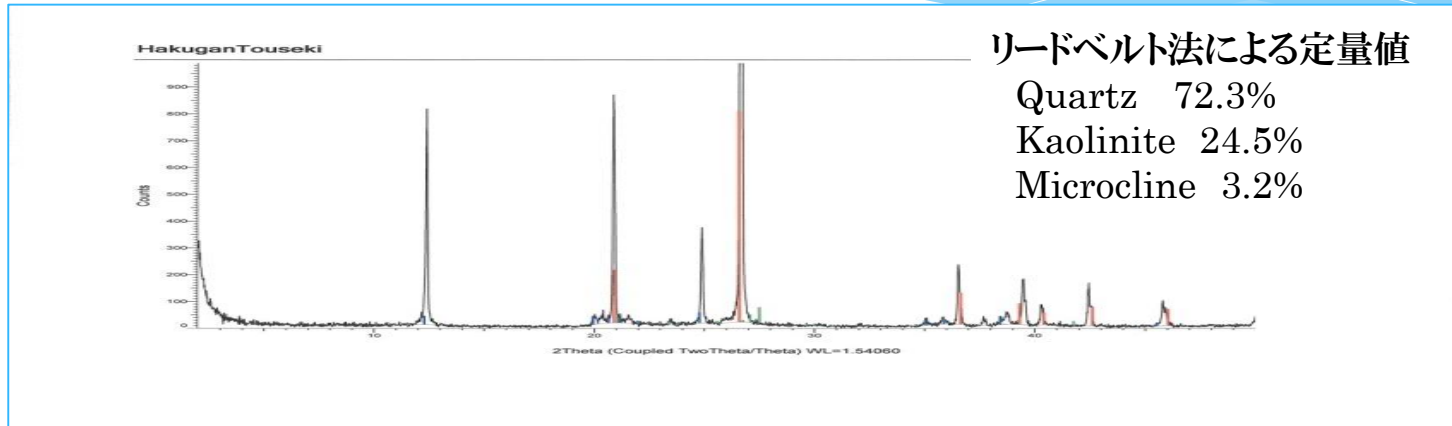


溶液作成



鉍物組成分析(粉末X線回折法)

解析ソフト(リードベルト)を搭載。要望により定量可能
分析例 陶石



形態観察と化学成分(SEM - EDX)

SEMで観察した画像をEDX(マッピング)で解析

分析例 耐火煉瓦の断面

